

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

FAKULTÄT INFORMATIK

INSTITUT FÜR SOFTWARE- UND MULTIMEDIATECHNIK

PROFESSUR FÜR COMPUTERGRAPHIK UND VISUALISIERUNG

PROF. DR. STEFAN GUMHOLD

Großer Beleg

Parameter Reconstruction for Small Angle X-Ray Scattering with Deep Learning

Patrick Stiller

(Mat.-Nr.: 3951290)

Betreuer: Dr. Dmitrij Schlesinger, Dr. Heide Meissner, Dr. Michael Bussmann

Dresden, 24. September 2018

Aufgabenstellung

Text der Aufgabenstellung...

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir am heutigen Tag dem Prüfungsausschuss der Fakultät Informatik eingereichte Arbeit zum Thema:

Parameter Reconstruction for Small Angle X-Ray Scattering with Deep Learning

vollkommen selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Dresden, den 24. September 2018

Patrick Stiller

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung | 3 |
| 2 | Grundlagen | 4 |
| 2.1 | Small Angle X-Ray Scattering with free electron laser pulses | 4 |
| 2.1.1 | Motivation | 4 |
| 2.1.2 | Experimentbeschreibung | 4 |
| 2.1.2.1 | Target | 5 |
| 2.1.2.2 | Small Angle X-Ray Scattering | 6 |
| 2.1.2.3 | Hochintensitätslaser | 7 |
| 2.1.3 | Problemidentifikation | 8 |
| 2.2 | Fouriertransformation | 8 |
| 2.3 | Neuronale Netze | 8 |
| 2.3.1 | Aufbau | 8 |
| 2.3.2 | Training | 8 |
| 3 | Simulation | 9 |
| 3.1 | Motivation | 9 |
| 3.2 | Simulationsbeschreibung | 9 |
| 3.2.1 | Gitterbeschreibung | 9 |
| 3.2.2 | Simulation des Detektorinputs | 9 |
| 3.2.3 | Simulation der Detektoreigenschaften | 9 |
| 4 | Datenbasis | 10 |
| 4.1 | Generator | 10 |
| 4.1.1 | Aufbau | 10 |
| 4.1.2 | Wahl der Eingangsparameter | 10 |
| 4.2 | Training-, Validation- und Testdatensatz | 10 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5 | Neuronales Netz | 11 |
| 5.1 | Architektur | 11 |
| 5.2 | Lossfunction | 11 |
| 5.3 | Optimizer | 11 |
| 6 | Ergebnisse und Diskussion | 12 |
| 6.1 | Lernprozess | 12 |
| 6.2 | Ergebnisse und statistische Auswertung | 12 |
| 6.3 | Fazit | 12 |
| | Literaturverzeichnis | 13 |

1 Einleitung

2 Grundlagen

2.1 Small Angle X-Ray Scattering with free electron laser pulses

2.1.1 Motivation

Das Small Angle X-Ray Scattering(SAXS) ist eine universelle Technik zur Untersuchung von Feststoffen. Dabei liefert SAXS Informationen über die kristalline Struktur, chemische Komposition und die physikalische Eigenschaften des untersuchten Feststoffes [Cro]. Die Untersuchung von Feststoffen unter Einfluss von Kurzpulslasern ist eine wichtige Aufgabe der heutigen Physik. Wissen über das Verhalten von Feststoffen unter Einfluss von Kurzpulslasern kann offene Fragen in der Krebsforschung und in der Astrophysik beantworten[KRM⁺18]. In diesem Beleg wurde SAXS für die Untersuchung von Plasma eingesetzt.

2.1.2 Experimentbeschreibung

Das Experiment besteht aus vier Hauptkomponenten (siehe Abbildung 2.1). Dem Target, dem Hochintensitätslaser (UHI), dem Röntgen-Freie-Elektronen-Laser(XFEL) und dem Detektor. Während des Experiments wird das Target durch den Hochintensitätslaser in einem Winkel von 90° beschossen. Aufgrund des Elektrischen Feldes des Lasers entsteht Plasma. Bei Plasma handelt es sich um ein Gemisch aus freien Elektronen, positiven Ionen und neutralen Teilchen, welche unter ständiger Wechselwirkung untereinander und mit Photonen stehen. Dadurch kann es zu unterschiedlichen Energie- bzw. Anregungszuständen kommen. Der Plasmazustand eines Stoffes wird auch als vierter Aggregatzustand bezeichnet [Wis]. Wurde Plasma erzeugt, soll es auf seine Struktur und Elektrodynamik untersucht werden. Dafür wird leicht zeitversetzt ein zweiter Laser benutzt. Dabei handelt es sich um einen Röntgen-Freie-Elektronen-Laser, welcher in einem Winkel von 45° mit einer Pulsdauer von 40 Femtosekunden auf das Target schießt. Dabei wird das Resultat, wie man es bei einer klassischen Röntgenaufnahme kennt, durch einen Detektor, welcher hinter dem Target platziert ist, aufgenommen [KRM⁺18]. In den nächsten drei Unterkapiteln werden die Hauptkomponenten detaillierter untersucht und dessen Beitrag zum Experiment genauer beschrieben.

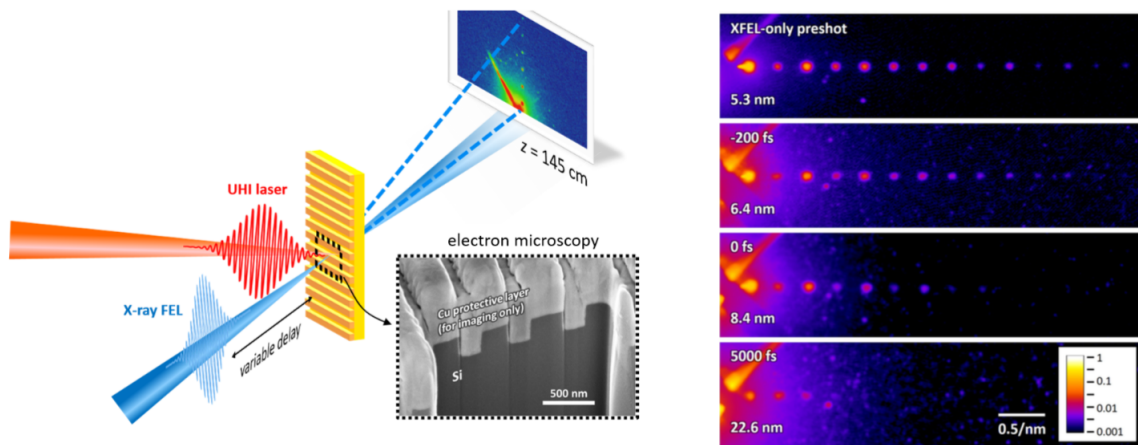


Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau des Experimentaufbaus. Die vier Hauptkomponenten sind durch die vorher eingeführten Abkürzungen notiert. Im rechten Teil der Abbildung sind Detektorbilder in Abhängigkeit des Einsetzens des Röntgenlaserpulses dargestellt. Der dargestellte Effekt wird im übernächsten Kapitel genauer erklärt. Bildquelle: [KRM⁺18]

2.1.2.1 Target

Um das Target analytisch beschreiben zu können und das Experiment Resultat zu vereinfachen und somit besser verstehen zu können, wurden die Targets als regelmäßiges Gitter (Grating) designed. Dafür wurde das Target mit einer $2\text{ }\mu\text{m}$ breiten Siliziumschicht überzogen und das Grating in diese Schicht eingraviert. Der Effekt des gewählten Targetdesigns ist, dass das Grating einen eindimensionalen Informationsgehalt hat und somit auch durch eine eindimensionale Funktion in Abhängigkeit von drei Parametern beschrieben werden kann (siehe Abbildung 2.2). Die drei Parameter sind Wellenlänge, Erhöhungsbreite und Aufweichungsbreite. Dabei beschreiben Wellenlänge, Erhöhungsbreite die Struktur des Gratings und die Aufweichungsbreite den Aufweichungseffekt des Hochenergielasers, auf den aber in einem späteren Kapitel eingegangen wird.

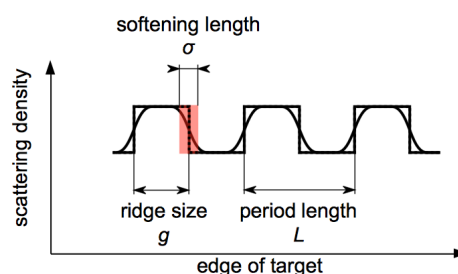


Abbildung 2.2: Analytische Beschreibung des Querschnittes des Targets. Dabei ist das Grating zu erkennen und dass es durch drei Parameter: Wellenlänge, Erhöhungsbreite und Aufweichungsbreite beschrieben werden kann. Bildquelle: [Zac17]

Der vorher erwähnte funktionale Zusammenhang wird im späteren Simulationskapitel genauer erläutert. Weiterhin müssen noch Begrifflichkeiten bezüglich des Targets geklärt werden. Die Erhöhungen des Gratings werden auch Features genannt und in diesem Kontext wird die Erhöhungsbreite auch Feature-size oder fsize genannt. Das Gitter wird in den meisten Fällen als Welle betrachtet, daher auch die Wahl des Parameternamen Wellenlänge. Weiterhin wird die Wellenlänge auch als Pitch bezeichnet. Ein letzter wichtiger Begriff ist die Elektronendichteverteilung η . Dabei ist das Grating ein Synonym für die Elektronendichteverteilung, dabei werden Features auch als Bereiche mit hoher Energiedichte bezeichnet.

2.1.2.2 Small Angle X-Ray Scattering

Um das Plasma auf seine Struktur zu untersuchen wird der Ansatz des Small Angle X-Ray Scatterings mit Hilfe eines X-ray Free Electron Lasers (XFEL) verwendet. Bei diesem Small Angle X-Ray Scattering Ansatz wird ein Frei Elektronen Röntgenlaser in einem kleinen Winkel von 45° auf das Target geschossen (Abbildung 2.1). Bei diesem Vorgang kommt es zu einem Streuvorgang des Lichts des Röntgenlasers an den Elektronen des Targets. Die Intensitäten des gestreuten Röntgenlasers werden durch einen Detektor, welches hinter dem Target platziert ist, gemessen. (Abbildung 2.1). Beim Detektor handelt es sich um ein Raster von Lichtdetektoren, welche die ankommenden Lichtintensitäten messen. Dabei ist der Lichtdetektor zeitintegrierend, dass heißt, das ankommende Lichtintensitäten über die Zeit summiert werden. Diesen Effekt kann man in der Abbildung 2.3 erkennen, welche den Steuprozess an zwei Elektronen zeigt.

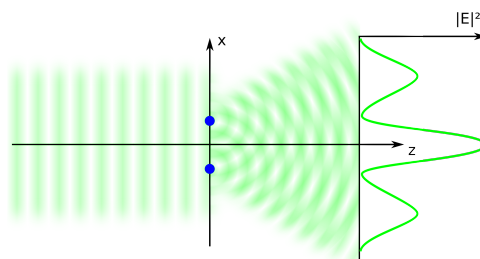


Abbildung 2.3: Beispielhafte Darstellung einer Streuung an zwei Elektronen. Die Röntgenlaserpulse treffen geradlinig auf die Elektronen und werden dann bei den Elektronen gestreut. Der Detektor dahinter misst die ankommenden Intensitäten der kreisförmigen Wellen und summiert diese über die Zeit. Bildquelle: [Zac17]

Durch die Zeitintegrität des Detektors, gehen die zeitlichen Abstände der Wellen verloren (Phase) zusätzlich kann es dazu kommen, dass ankommende Wellen mehrere Detektorzellen gleichzeitig treffen, dabei kommt es zu einem Verschmierungseffekt im Detektorbild. Der funktionale Zusammenhang für den Streuvorgang ist in Gleichung 2.1 definiert.

$$\Phi = \phi_0 \cdot \Delta\Omega \cdot T \cdot \epsilon \cdot |r_0 \cdot \int \eta_e(\vec{r}) \cdot e^{i\vec{q}\vec{r}} d\vec{r}|^2 \quad (2.1)$$

Der wichtigste Aspekt ist der hintere Teil der Gleichung. Denn in diesem Teil werden die Intensitäten des Detektorbildes Φ , welches äquivalent zum Betragsquadrat der Fouriertransformation der Elektronendichte η ist.

2.1.2.3 Hochintensitätslaser

Die letzte wichtige Komponente ist der Hochintensitätslaser, welcher zur Generierung von Plasma aus den Targets zuständig ist. Der Hochintensitätslaser hat Einfluss sowohl auf das Target sowie auf das Detektorbild, welcher in diesem Kapitel untersucht wird. Der Hochintensitätslaser (UHI), welcher im 90° Winkel auf das Target schießt (Abbildung 2.1), reißt mit seinem elektrischen Feld die Elektronen aus den Atomkernen des Targets. Dabei entsteht in einem Sekundenbruchteil Plasma. Zeitgleich kommt es zu einem Temperaturanstieg, welcher zu einem Schmelzprozess des Targets und somit zu einer Veränderung der Elektronendichteverteilung η führt [KRM⁺18]. Diesen Schmelzprozess ist in Abbildung 2.4 erkennbar.

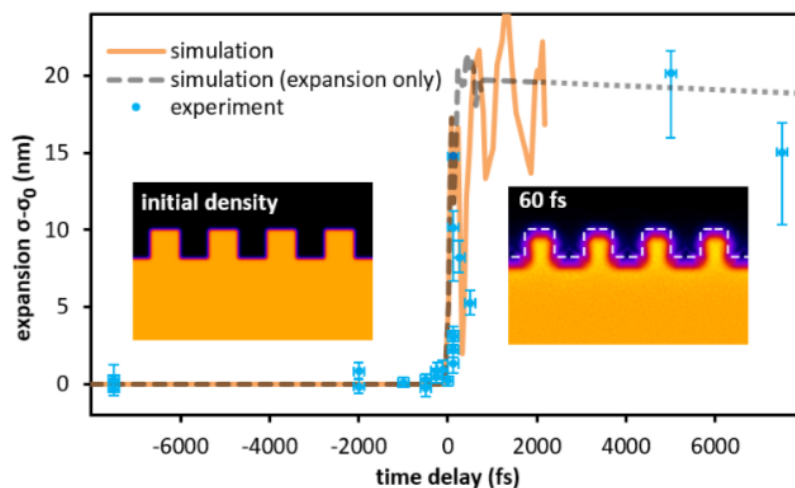


Abbildung 2.4: Veränderung der Elektronendichteverteilung nach einer Bestrahlungsdauer von 60 Femtosekunden Bildquelle: [KRM⁺18]

Ein Nebeneffekt des Schmelzvorgangs ist der Informationsverlust der ursprünglichen Kantenstruktur, welcher sich auch im Detektorbild bemerkbar macht. Im rechten Teil der Abbildung 2.1 ist erkennbar, dass mit späterem Einsätzen des Röntgenlasers, was äquivalent zu längeren Bestrahlungsdauer des Hochintensitätslaser ist, Informationspunkte am Rand des Detektorbildes verloren gehen.

2.1.3 Problemidentifikation

2.2 Fouriertransformation

2.3 Neuronale Netze

2.3.1 Aufbau

2.3.2 Training

3 Simulation

3.1 Motivation

3.2 Simulationsbeschreibung

3.2.1 Gitterbeschreibung

3.2.2 Simulation des Detektorinputs

3.2.3 Simulation der Detektoreigenschaften

4 Datenbasis

4.1 Generator

4.1.1 Aufbau

4.1.2 Wahl der Eingangsparameter

4.2 Training-, Validation- und Testdatensatz

5 Neuronales Netz

5.1 Architektur

5.2 Lossfunction

5.3 Optimizer

6 Ergebnisse und Diskussion

6.1 Lernprozess

6.2 Ergebnisse und statistische Auswertung

6.3 Fazit

Literaturverzeichnis

- [Cro] CROCE, Gianluca: *The Small Angle X-ray Scattering Technique: An Overview*. – <http://people.unipmn.it/gcroce/download/theory.pdf>
- [KRM⁺18] KLUGE, Thomas ; RÖDEL, Melanie ; METZKES, Josefine ; PELKA, Alexander ; GARCIA, Alejandro L. ; PRENCIPE, Irene ; REHWALD, Martin ; NAKATSUTSUMI, Motoaki ; MCBRIDE, Emma E. ; SCHÖNHERR, Tommy ; GARTEN, Marco ; HARTLEY, Nicholas J. ; ZACHARIAS, Malte ; ERBE, Arthur ; GEORGIEV, Yordan M. ; GALTIER, Eric ; NAM, Inhyuk ; LEE, Hae J. ; GLENZER, Siegfried ; BUSSMANN, Michael ; GUTT, Christian ; ZEIL, Karl ; RÖDEL, Christian ; HÜBNER, Uwe ; SCHRAMM, Ulrich ; COWAN, Thomas E.: *Observation of ultrafast solid-density plasma dynamics using femtosecond X-ray pulses from a free-electron laser*. 2018
- [Wis] WISSENSCHAFT, Spektrum der: *Plasma*
- [Zac17] ZACHARIAS, Malte: *MODEL-DRIVEN PARAMETER RECONSTRUCTIONS FROM SMALL ANGLE X-RAY SCATTERING IMAGES*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1208410>. Version: November 2017

Danksagung

Die Danksagung...

Erklärungen zum Urheberrecht

Hier soll jeder Autor die von ihm eingeholten Zustimmungen der Copyright-Besitzer angeben bzw. die in Web Press Rooms angegebenen generellen Konditionen seiner Text- und Bildübernahmen zitieren.